

# SPIE Electronic Imaging 2010 - San Jose, USA , 17 – 21 stycznia 2010

Udział wzięli:

dr inż. Robert Sitnik, mgr inż. Jakub Krzesłowski,  
mgr inż. Grzegorz Mączkowski i mgr inż. Marcin Witkowski

## ***Integrated shape, color and reflectivity measurement method for 3D digitization of cultural heritage objects***

R. Sitnik, G. Mączkowski,  
J. Krzesłowski

## ***Automation of 3D scan data capturing and processing***

W. Jędrzejec (AFAW), R. Sitnik,  
K. Warmiński (AFAW)

## ***A four-directional body shape measurement system and its application for pectus excavatum severity***

***assessment*** M. Witkowski (WUT), W. Glinkowski (MUW), R. Sitnik  
(WUT), H. Kocon (MUW), P. Bolewicki (WUT), A. Górecki (MUW)

